

Surfscan® SP A2/A3

パターン無しウェーハ検査装置が、半導体チップの歩留まりと信頼性に影響を及ぼす様々な重大欠陥や表面品質の問題を検出します。

メリット :

Surfscan SP A2 および SP A3は、高い検出感度とスループットで重大な欠陥を検出することにより、チップ、ウェーハ、製造装置メーカーのプロセスおよびプロセスツールの性能評価や管理をサポートし、車載用チップメーカーを支援します。

- R&Dや量産チップの信頼性に影響を与えるランダムな原因を特定することにより、ゼロ欠陥の実現をサポート
- 各プロセスツールが自動車業界に求められる最低限の信頼性を満たすことを担保しながら、プロセスツールの不完全性の原因に対処するための継続的改善プログラムを実施
- 車載用チップ製造のワークフローで使用するための最良のプロセスツールを識別

テクノロジー :

- DUVレーザーソースおよびDUVに最適化された光学系
- 標準装備のダークフィールドとオプションのブライトフィールドの検査モードによる一括検査
- 欠陥や欠陥マップの特徴による自動分類
- 高性能アルゴリズムおよびイメージコンピュータ
- SURFmonitor™によるウェーハ表面品質測定と特性評価モジュール
- SurfServer®によるレシピの運用管理

用途 :

- 出荷時および入荷時のウェーハ品質管理
- 量産における材料、化学薬品、プロセス、プロセスツールの適格性評価とモニタリング
- R&D時のプロセス特性評価、デバッグ、適格性評価



市場 :

以下を含む多様な半導体製造セグメント :

- 自動車、IoT、5G、民生品、工業（軍事、航空宇宙、医療）用のチップ製造
- ウェーハ製造
- 半導体の製造装置および材料/化学薬品の製造

プラットフォーム :

- カスタマイズ可能な構成

ウェーハのサイズ :

- Surfscan SP A3: 300mm
- Surfscan SP A2: 200mm, 150mm

詳細情報 :

www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2